

Análise com MEV e AFM da variação da morfologia superficial da resina TPH (Dentsply) após técnicas diferentes de polimento

Bortoluci, C.D.; Marin, T. S.; Santos, A. D.

A microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e a Microscopia de Força Atômica (AFM), são ferramentas muito poderosas quando se analisa superfície de materiais. O procedimento clínico de uma restauração dental com resina composta se finaliza com o acabamento e polimento da sua superfície, visando melhora a lisura (rugosidade) desta superfície. Com o uso das ferramentas MEV e AFM, podemos fazer uma avaliação muito precisa da variação da rugosidade destes materiais. Sendo assim a proposta deste trabalho foi verificar a rugosidade e a área de superfície da resina micro híbrida TPH (Dentsply) após o polimento com duas técnicas diferentes: Kit acabamento e polimento resina composta da KG Sorensen (Cotia-SP) e pontas abrasivas da TDV (Pomerode)-SC. Foram preparadas doze amostras, divididas em 2 grupos (n=5), sendo 2 de controle. Estas foram fotopolimerizadas de acordo com a orientação do fabricante, e permaneceram imersas por 24 h em água deionizada, após este período passaram pelos processos de acabamento e polimento propostos. A análise dos resultados mostraram que estatisticamente (ANOVA-Tukey) não existe diferença entre os valores obtidos neste estudo, mostrando que as duas técnicas promovem um polimento eficiente.

Palavras-chave: Microscopia; microscopia de força atômica; microscopia eletrônica de varredura.



4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica "Prof. Dr. José Eduardo Rodrigues"
10º Simpósio de Pós-Graduação "Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia"
3º Encontro de Técnicos em Laboratório "Rosimeire de Oliveira M. Gon"
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados